

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Kiyoshi HAYASE

GAU:

SERIAL NO: NEW APPLICATION

EXAMINER:

FILED: HEREWITH

FOR: MULTIPROCESSOR SYSTEM CAPABLE OF EFFICIENTLY DEBUGGING PROCESSORS

REQUEST FOR PRIORITY

COMMISSIONER FOR PATENTS
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number _____, filed _____, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.

☐ Full benefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e): Application No. _____ Date Filed _____

☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

COUNTRY
Japan

APPLICATION NUMBER
2002-330310

MONTH/DAY/YEAR
November 14, 2002

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

☒ are submitted herewith

☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

☐ were filed in prior application Serial No. _____ filed _____

☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number _____

Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. _____ filed _____; and

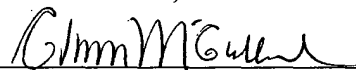
☐ (B) Application Serial No.(s) _____

☐ are submitted herewith

☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.


Marvin J. Spivak

Registration No. 24,913

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220
(OSMMN 05/03)

C. Irvin McClelland
Registration Number 21,124

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2002年11月14日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-330310

[ST.10/C]:

[JP2002-330310]

出 願 人

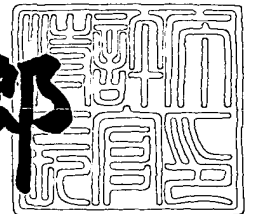
Applicant(s):

三菱電機株式会社

2002年12月10日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2002-3097708

【書類名】 特許願

【整理番号】 542080JP01

【提出日】 平成14年11月14日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G06F 11/22

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社
社内

【氏名】 早瀬 清

【特許出願人】

【識別番号】 000006013

【氏名又は名称】 三菱電機株式会社

【代理人】

【識別番号】 100089233

【弁理士】

【氏名又は名称】 吉田 茂明

【選任した代理人】

【識別番号】 100088672

【弁理士】

【氏名又は名称】 吉竹 英俊

【選任した代理人】

【識別番号】 100088845

【弁理士】

【氏名又は名称】 有田 貴弘

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012852

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】	図面	1
【物件名】	要約書	1
【プルーフの要否】	要	

【書類名】 明細書

【発明の名称】 マルチプロセッサシステム

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 複数のプロセッサと、

前記複数のプロセッサのデバッグを実行する、少なくとも一つのデバッグ実行部と、

前記デバッグ実行部を制御する、少なくとも一つのコントローラと、

外部のデバッグ装置に接続される、一組の端子群と、

前記複数のプロセッサの中から、デバッグを実行すべき少なくとも一つ又は全部のプロセッサを選択する選択回路と
を備える、マルチプロセッサシステム。

【請求項 2】 前記複数のプロセッサは、第 1 及び第 2 のプロセッサを含み

、
前記デバッグ実行部は、前記第 1 のプロセッサに接続された第 1 のデバッグ実行部と、前記第 2 のプロセッサに接続された第 2 のデバッグ実行部とを含み、

前記コントローラは、前記第 1 のデバッグ実行部に接続された第 1 のコントローラと、前記第 2 のデバッグ実行部に接続された第 2 のコントローラとを含み、

前記選択回路は、前記第 1 及び第 2 のコントローラと前記端子群との間に接続されており、

前記選択回路は、前記デバッグ装置から前記端子群を介して入力されてきたデバッグ用の信号を、前記第 1 及び第 2 のコントローラのうちの一方又は双方に入力する、請求項 1 に記載のマルチプロセッサシステム。

【請求項 3】 前記複数のプロセッサは、第 1 及び第 2 のプロセッサを含み

、
前記デバッグ実行部は、前記第 1 のプロセッサに接続された第 1 のデバッグ実行部と、前記第 2 のプロセッサに接続された第 2 のデバッグ実行部とを含み、

前記選択回路は、前記第 1 及び第 2 のデバッグ実行部と前記コントローラとの間に接続されており、

前記コントローラは、前記端子群に接続されており、

前記選択回路は、前記コントローラから出力されたデバッグ用の信号を、前記第 1 及び第 2 のデバッグ実行部のうちの一方又は双方に入力する、請求項 1 に記載のマルチプロセッサシステム。

【請求項 4】 前記複数のプロセッサは、第 1 及び第 2 のプロセッサを含み、

前記選択回路は、前記第 1 及び第 2 のプロセッサと前記デバッグ実行部との間に接続されており、

前記デバッグ実行部は前記コントローラに接続されており、

前記コントローラは前記端子群に接続されており、

前記選択回路は、前記デバッグ実行部から出力されたデバッグ用の信号を、前記第 1 及び第 2 のプロセッサのうちの一方又は双方に入力する、請求項 1 に記載のマルチプロセッサシステム。

【請求項 5】 前記選択回路は、所定のレジスタの設定に基づいて、デバッグを実行すべき前記プロセッサを選択する、請求項 1 ～ 4 のいずれか一つに記載のマルチプロセッサシステム。

【請求項 6】 前記選択回路は、外部から所定の端子に入力される選択信号に基づいて、デバッグを実行すべき前記プロセッサを選択する、請求項 1 ～ 4 のいずれか一つに記載のマルチプロセッサシステム。

【請求項 7】 第 1 及び第 2 のプロセッサと、

前記第 1 のプロセッサに接続された第 1 のデバッグ実行部、及び前記第 2 のプロセッサに接続された第 2 のデバッグ実行部と、

前記第 1 のデバッグ実行部に接続された第 1 のコントローラ、及び前記第 2 のデバッグ実行部に接続された第 2 のコントローラと、

前記第 1 のコントローラに選択的に接続された第 1 の端子群、及び前記第 2 のコントローラに選択的に接続された第 2 の端子群と、

前記第 1 の端子群と前記第 1 及び第 2 のコントローラとの間に接続された選択回路と

を備え、

前記第 1 及び第 2 の端子群の双方にデバッグ装置がそれぞれ接続される第 1 モ

ードにおいて、前記選択回路は、前記第 1 のコントローラと前記第 1 の端子群とを接続するとともに、前記第 2 のコントローラと前記第 2 の端子群とを接続し、

前記第 1 の端子群のみに前記デバッグ装置が接続される第 2 モードにおいて、前記選択回路は、前記デバッグ装置から前記第 1 の端子群を介して入力されてきたデバッグ用の信号を、前記第 1 及び第 2 のコントローラのうちの一方又は双方に入力する、マルチプロセッサシステム。

【請求項 8】 前記第 1 モードと前記第 2 モードとの切り替えは、外部から所定の端子に入力される選択信号に基づいて行われる、請求項 7 に記載のマルチプロセッサシステム。

【請求項 9】 前記第 1 モードと前記第 2 モードとの切り替えは、所定のレジスタの設定に基づいて行われる、請求項 7 に記載のマルチプロセッサシステム。

【請求項 10】 前記第 2 の端子群に前記デバッグ装置が接続されているか否かを検出する検出回路をさらに備え、

前記第 1 モードと前記第 2 モードとの切り替えは、前記検出回路の検出結果に基づいて行われる、請求項 7 に記載のマルチプロセッサシステム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明はマルチプロセッサシステムに関し、特に、プロセッサのデバッグを効率的に実行することが可能なマルチプロセッサシステムに関するものである。

【0002】

【従来の技術】

従来の第 1 のマルチプロセッサシステムでは、搭載されているプロセッサの個数と同数のデバッグ用端子群が設けられている。そして、各端子群にデバッグ装置をそれぞれ接続することにより、各デバッグ装置を用いて各プロセッサのデバッグが独立に行われている。

【0003】

従来の第 2 のマルチプロセッサシステムでは、一組のデバッグ用端子群が設け

られている。そして、各プロセッサに接続されている各TAPコントローラをシリアルに接続することにより、1台のデバッグ装置を用いて全てのプロセッサに関するデバッグが行われている。

【0004】

なお、プロセッサのデバッグに関する技術が、下記の特許文献1、2に記載されている。

【0005】

【特許文献1】

特開2000-73363号公報

【特許文献2】

特開2000-24201号公報

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、従来の第1のマルチプロセッサシステムによると、搭載されているプロセッサの個数が増えると、それに応じてデバッグ用端子群及びデバッグ装置を追加する必要があるため、コストの上昇を招くという問題がある。

【0007】

また、従来の第2のマルチプロセッサシステムによると、常に全てのTAPコントローラを経由して全てのプロセッサに関するデバッグが行われるため、デバッグの所要時間が長くなるという問題がある。

【0008】

本発明はかかる問題を解決するために成されたものであり、コストの低減を図りつつ、複数のプロセッサのデバッグを効率的に実行することが可能なマルチプロセッサシステムを得ることを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】

第1の発明に係るマルチプロセッサシステムは、複数のプロセッサと、複数のプロセッサのデバッグを実行する、少なくとも一つのデバッグ実行部と、デバッグ実行部を制御する、少なくとも一つのコントローラと、外部のデバッグ装置に

接続される、一組の端子群と、複数のプロセッサの中から、デバックを実行すべき少なくとも一つ又は全部のプロセッサを選択する選択回路とを備える。

【 0 0 1 0 】

第 2 の発明に係るマルチプロセッサシステムは、第 1 及び第 2 のプロセッサと、第 1 のプロセッサに接続された第 1 のデバッグ実行部、及び第 2 のプロセッサに接続された第 2 のデバッグ実行部と、第 1 のデバッグ実行部に接続された第 1 のコントローラ、及び第 2 のデバッグ実行部に接続された第 2 のコントローラと、第 1 のコントローラに選択的に接続された第 1 の端子群、及び第 2 のコントローラに選択的に接続された第 2 の端子群と、第 1 の端子群と第 1 及び第 2 のコントローラとの間に接続された選択回路とを備え、第 1 及び第 2 の端子群の双方にデバッグ装置がそれぞれ接続される第 1 モードにおいて、選択回路は、第 1 のコントローラと第 1 の端子群とを接続するとともに、第 2 のコントローラと第 2 の端子群とを接続し、第 1 の端子群のみにデバッグ装置が接続される第 2 モードにおいて、選択回路は、デバッグ装置から第 1 の端子群を介して入力されてきたデバック用の信号を、第 1 及び第 2 のコントローラのうちの一方又は双方に入力する。

【 0 0 1 1 】

【発明の実施の形態】

以下、説明の簡略化のため 2 個の CPU を備えるマルチプロセッサシステムを例にとり、本発明の実施の形態について具体的に説明する。但し、CPU の数は 2 個に限定されるものではなく、3 個以上の CPU を備えるマルチプロセッサに対しても、本発明は適用可能である。

【 0 0 1 2 】

実施の形態 1.

図 1 は、本発明の実施の形態 1 に係るマルチプロセッサシステムの構成を示すブロック図である。チップ 1 は、複数の CPU 7_0 , 7_1 と、CPU 7_0 , 7_1 のデバックを実行するデバッグ実行部 8_0 , 8_1 と、デバッグ実行部 8_0 , 8_1 を制御する TAP コントローラ 9_0 , 9_1 と、CPU 7_0 , 7_1 の中から、デバックを実行すべき少なくとも一つの CPU を選択する選択回路 10 と、端子 2 ～ 6 を含む一組

の端子群とを備えている。CPU 7₀, 7₁は、それぞれデバッグ実行部 8₀, 8₁に接続されており、デバッグ実行部 8₀, 8₁は、それぞれTAPコントローラ 9₀, 9₁に接続されている。選択回路 10は、TAPコントローラ 9₀, 9₁と端子 2～6との間に接続されている。端子 2～6には、JTAG規格に準拠したICE等のデバッグ装置（図示しない）が接続される。

【0013】

選択回路 10は、TAPコントローラ 100、レジスタ 101、AND回路 102～105、及びセクタ 106, 107を備えている。AND回路 102の一方の入力端子は端子 4に、他方の入力端子はレジスタ 101に、出力端子はTAPコントローラ 9₀のTMS端子に、それぞれ接続されている。AND回路 103の一方の入力端子は端子 5に、他方の入力端子はレジスタ 101に、出力端子はTAPコントローラ 9₀のTDI端子に、それぞれ接続されている。AND回路 104の一方の入力端子は端子 4に、他方の入力端子はレジスタ 101に、出力端子はTAPコントローラ 9₁のTMS端子に、それぞれ接続されている。AND回路 105の一方の入力端子は端子 5に、他方の入力端子はレジスタ 101に、出力端子はTAPコントローラ 9₁のTDI端子に、それぞれ接続されている。セクタ 106の一方の入力端子はTAPコントローラ 9₀のTDO端子に、他方の入力端子はTAPコントローラ 9₁のTDO端子に、出力端子はセクタ 107を介して端子 6に、それぞれ接続されている。

【0014】

次に、本実施の形態 1に係るマルチプロセッサシステムの動作について説明する。まず、デバッグを実行すべきCPUを選択するために、デバッグ装置又はCPU 7₀, 7₁からTAPコントローラ 100にアクセスする。CPU 7₀のみのデバッグを実行する場合、TAPコントローラ 100は、信号 S11が「H (high)」、信号 S12が「L (Low)」、信号 S10が「L」になるように、レジスタ 101を設定する。CPU 7₁のみのデバッグを実行する場合、TAPコントローラ 100は、信号 S11が「L」、信号 S12が「H」、信号 S10が「H」になるように、レジスタ 101を設定する。CPU 7₀, 7₁の双方のデバッグを実行する場合、TAPコントローラ 100は、信号 S11, S12がともに「

H」になるように、レジスタ101を設定する。また、この場合、信号S10が順次に「L」「H」となるように、レジスタ101が設定される。

【0015】

信号S11は、AND回路102, 103の各他方の入力端子にそれぞれ入力される。信号S12は、AND回路104, 105の各他方の入力端子にそれぞれ入力される。信号S10は、セクタ106の選択端子に入力される。

【0016】

次に、デバッグ装置から端子4を介して、AND回路102, 104の各一方の入力端子に、TMS信号がそれぞれ入力される。また、デバッグ装置から端子5を介して、AND回路103, 105の各一方の入力端子に、TDI信号がそれぞれ入力される。TAPコントローラ9₀, 9₁の各TCK端子には、デバッグ装置から端子2を介してTCK信号がそれぞれ入力され、TAPコントローラ9₀, 9₁の各TRST端子には、デバッグ装置から端子3を介してTRST信号がそれぞれ入力される。

【0017】

上記の通り、CPU7₀のみのデバッグを実行する場合、信号S11は「H」、信号S12は「L」である。従って、TMS信号及びTDI信号は、AND回路102, 103の各出力端子から、TAPコントローラ9₀のTMS端子及びTDI端子に、それぞれ入力される。一方、TAPコントローラ9₁のTMS端子及びTDI端子には、TMS信号及びTDI信号は入力されない。

【0018】

TAPコントローラ9₀は、所定のコマンドを生成してデバッグ実行部8₀に入力する。デバッグ実行部8₀は、CPU7₀にブレーク要求、スタート要求、命令コードを入力し、CPU7₀のデバッグが実行される。デバッグの結果に関するデータは、CPU7₀からデバッグ実行部8₀を介してTAPコントローラ9₀に入力される。上記の通り、CPU7₀のみのデバッグを実行する場合、信号S10は「L」である。また、セクタ107は、通常はセクタ106側に設定されている。従って、データは、TAPコントローラ9₀のTDO端子から、セクタ106, 107及び端子6を介して、外部に出力される。

【0019】

また、上記の通り、CPU7₁のみのデバッグを実行する場合、信号S11は「L」、信号S12は「H」である。従って、TMS信号及びTDI信号は、AND回路104、105の各出力端子から、TAPコントローラ9₁のTMS端子及びTDI端子に、それぞれ入力される。一方、TAPコントローラ9₀のTMS端子及びTDI端子には、TMS信号及びTDI信号は入力されない。

【0020】

TAPコントローラ9₁は、所定のコマンドを生成してデバッグ実行部8₁に力する。デバッグ実行部8₁は、CPU7₁にブレーク要求、スタート要求、命令コードを入力し、CPU7₁のデバッグが実行される。デバッグの結果に関するデータは、CPU7₁からデバッグ実行部8₁を介してTAPコントローラ9₁に力される。上記の通り、CPU7₁のみのデバッグを実行する場合、信号S10は「H」である。また、セクタ107は、通常はセクタ106側に設定されている。従って、データは、TAPコントローラ9₁のTDO端子から、セクタ106、107及び端子6を介して、外部に出力される。

【0021】

さらに、上記の通り、CPU7₀、7₁の双方のデバッグを実行する場合、信号S11、S12はともに「H」である。従って、TMS信号は、AND回路102、104の各出力端子から、TAPコントローラ9₀、9₁の各TMS端子に、それぞれ入力される。また、TDI信号は、AND回路103、105の各出力端子から、TAPコントローラ9₀、9₁の各TDI端子に、それぞれ入力される。その結果、上記と同様にしてCPU7₀、7₁のデバッグが実行される。

【0022】

上記の通り、CPU7₀、7₁の双方のデバッグを実行する場合、信号S10は順次に「L」「H」となる。従って、端子6からは、CPU7₀のデバッグの結果に関するデータ、及びCPU7₁のデバッグの結果に関するデータが、この順に出力される。

【0023】

このように本実施の形態1に係るマルチプロセッサシステムは、端子2～6を

含む一組の端子群のみを備える。そして、選択回路 1 0 によって、複数の CPU 7_0 , 7_1 の中から、デバックを実行すべき少なくとも一つの CPU が選択される。従って、チップ 1 に搭載されている CPU の個数が増えたとしても、それに応じて端子 2 ~ 6 を追加する必要がない。その結果、一台のデバック装置のみを用いて複数の CPU 7_0 , 7_1 のデバックを実行できるため、コストの低減を図ることができる。

【 0 0 2 4 】

また、選択回路 1 0 によって全ての CPU 7_0 , 7_1 が選択された場合は、全ての CPU 7_0 , 7_1 に関して同時にデバックが行われる。そのため、複数の CPU 7_0 , 7_1 を備えるマルチプロセッサシステムにおいて、CPU 7_0 , 7_1 のデバックを効率的に実行することができる。

【 0 0 2 5 】

さらに、レジスタ 1 0 1 を用いた簡単な構成によって選択回路 1 0 が実現されているため、システムが大型化・複雑化することを、最小限にとどめることができる。

【 0 0 2 6 】

実施の形態 2.

図 2 は、本発明の実施の形態 2 に係るマルチプロセッサシステムの構成を示すブロック図である。チップ 1 は、CPU 7_0 , 7_1 と、デバック実行部 8_0 , 8_1 と、TAP コントローラ 9_0 , 9_1 と、CPU 7_0 , 7_1 の中から、デバックを実行すべき少なくとも一つの CPU を選択する選択回路 2 0 と、端子 2 ~ 6 と、端子 2 1 ~ 2 3 とを備えている。

【 0 0 2 7 】

選択回路 2 0 は、AND 回路 2 0 0 ~ 2 0 3 及びセクタ 2 0 4 を備えている。AND 回路 2 0 0 の一方の入力端子は端子 4 に、他方の入力端子は端子 2 1 に、出力端子は TAP コントローラ 9_0 の TMS 端子に、それぞれ接続されている。AND 回路 2 0 1 の一方の入力端子は端子 5 に、他方の入力端子は端子 2 1 に、出力端子は TAP コントローラ 9_0 の TDI 端子に、それぞれ接続されている。AND 回路 2 0 2 の一方の入力端子は端子 4 に、他方の入力端子は端子 2 3 に

、出力端子はTAPコントローラ 9_1 のTMS端子に、それぞれ接続されている。AND回路203の一方の入力端子は端子5に、他方の入力端子は端子23に、出力端子はTAPコントローラ 9_1 のTDI端子に、それぞれ接続されている。セクタ204の一方の入力端子はTAPコントローラ 9_0 のTDO端子に、他方の入力端子はTAPコントローラ 9_1 のTDO端子に、出力端子は端子6に、それぞれ接続されている。

【0028】

次に、本実施の形態2に係るマルチプロセッサシステムの動作について説明する。まず、デバッグを実行すべきCPUを選択するために、チップ1の外部から端子21, 22, 23に、それぞれ信号S21, S20, S22を入力する。CPU 7_0 のみのデバッグを実行する場合は、「H」の信号S21、「L」の信号S22、「L」の信号S20が入力される。CPU 7_1 のみのデバッグを実行する場合は、「L」の信号S21、「H」の信号S22、「H」の信号S20が入力される。CPU 7_0 , 7_1 の双方のデバッグを実行する場合は、いずれも「H」の信号S21, S22が入力される。また、この場合は、「L」「H」の信号S20が順次に入力される。

【0029】

信号S21は、AND回路200, 201の各他方の入力端子にそれぞれ入力される。信号S22は、AND回路202, 203の各他方の入力端子にそれぞれ入力される。信号S20は、セクタ204の選択端子に入力される。

【0030】

次に、デバッグ装置から端子4を介して、AND回路200, 202の各一方の入力端子に、TMS信号がそれぞれ入力される。また、デバッグ装置から端子5を介して、AND回路201, 203の各一方の入力端子に、TDI信号がそれぞれ入力される。

【0031】

上記の通り、CPU 7_0 のみのデバッグを実行する場合、信号S21は「H」、信号S22は「L」である。従って、TMS信号及びTDI信号は、AND回路200, 201の各出力端子から、TAPコントローラ 9_0 のTMS端子及び

TDI端子に、それぞれ入力される。一方、TAPコントローラ9₁のTMS端子及びTDI端子には、TMS信号及びTDI信号は入力されない。その結果、上記実施の形態1と同様にして、CPU7₀のみのデバッグが実行される。また、上記の通り、CPU7₀のみのデバッグを実行する場合、信号S20は「L」である。従って、CPU7₀のデバッグの結果に関するデータは、TAPコントローラ9₀のTDO端子から、セレクタ204及び端子6を介して、外部に出力される。

【0032】

また、上記の通り、CPU7₁のみのデバッグを実行する場合、信号S21は「L」、信号S22は「H」である。従って、TMS信号及びTDI信号は、AND回路202、203の各出力端子から、TAPコントローラ9₁のTMS端子及びTDI端子に、それぞれ入力される。一方、TAPコントローラ9₀のTMS端子及びTDI端子には、TMS信号及びTDI信号は入力されない。その結果、上記実施の形態1と同様にして、CPU7₁のみのデバッグが実行される。また、上記の通り、CPU7₁のみのデバッグを実行する場合、信号S20は「H」である。従って、CPU7₁のデバッグの結果に関するデータは、TAPコントローラ9₁のTDO端子から、セレクタ204及び端子6を介して、外部に出力される。

【0033】

さらに、上記の通り、CPU7₀、7₁の双方のデバッグを実行する場合、信号S21、S22はともに「H」である。従って、TMS信号は、AND回路200、202の各出力端子から、TAPコントローラ9₀、9₁の各TMS端子に、それぞれ入力される。また、TDI信号は、AND回路201、203の各出力端子から、TAPコントローラ9₀、9₁の各TDI端子に、それぞれ入力される。その結果、CPU7₀、7₁のデバッグが実行される。また、上記の通り、CPU7₀、7₁の双方のデバッグを実行する場合、信号S20は順次に「L」「H」となる。従って、端子6からは、CPU7₀のデバッグの結果に関するデータ、及びCPU7₁のデバッグの結果に関するデータが、この順に出力される。

【0034】

このように本実施の形態 2 に係るマルチプロセッサシステムは、端子 2 ～ 6 を含む一組の端子群のみを備える。そして、選択回路 2 0 によって、複数の CPU 7_0 、 7_1 の中から、デバッグを実行すべき少なくとも一つの CPU が選択される。従って、チップ 1 に搭載されている CPU の個数が増えたとしても、それに応じて端子 2 ～ 6 を追加する必要がない。その結果、一台のデバッグ装置のみを用いて複数の CPU 7_0 、 7_1 のデバッグを実行できるため、コストの低減を図ることができる。

【 0 0 3 5 】

また、選択回路 2 0 によって全ての CPU 7_0 、 7_1 が選択された場合は、全ての CPU 7_0 、 7_1 に関して同時にデバッグが行われる。そのため、複数の CPU 7_0 、 7_1 を備えるマルチプロセッサシステムにおいて、CPU 7_0 、 7_1 のデバッグを効率的に実行することができる。

【 0 0 3 6 】

さらに、端子 2 1 ～ 2 3 を用いた簡単な構成によって選択回路 2 0 が実現されているため、システムが大型化・複雑化することを、最小限にとどめることができる。

【 0 0 3 7 】

実施の形態 3.

図 3 は、本発明の実施の形態 3 に係るマルチプロセッサシステムの構成を示すブロック図である。チップ 1 は、複数の CPU 7_0 、 7_1 と、デバッグ実行部 8_0 、 8_1 と、デバッグ実行部 8_0 、 8_1 を制御する TAP コントローラ 9 と、CPU 7_0 、 7_1 の中から、デバッグを実行すべき少なくとも一つの CPU を選択する選択回路 3 0 と、端子 2 ～ 6 を含む一組の端子群とを備えている。CPU 7_0 、 7_1 は、それぞれデバッグ実行部 8_0 、 8_1 に接続されており、TAP コントローラ 9 は、端子 2 ～ 6 に接続されている。選択回路 3 0 は、デバッグ実行部 8_0 、 8_1 と TAP コントローラ 9 との間に接続されている。

【 0 0 3 8 】

選択回路 3 0 は、レジスタ 3 0 0、AND 回路 3 0 1、3 0 2、及びセレクタ 3 0 3 を備えている。AND 回路 3 0 1 の一方の入力端子は TAP コントローラ

9に、他方の入力端子はレジスタ300に、出力端子はデバッグ実行部8₀に、それぞれ接続されている。AND回路302の一方の入力端子はTAPコントローラ9に、他方の入力端子はレジスタ300に、出力端子はデバッグ実行部8₁に、それぞれ接続されている。セクタ303の一方の入力端子はデバッグ実行部8₀に、他方の入力端子はデバッグ実行部8₁に、出力端子はTAPコントローラ9に、それぞれ接続されている。

【0039】

次に、本実施の形態3に係るマルチプロセッサシステムの動作について説明する。まず、デバッグを実行すべきCPUを選択するために、デバッグ装置又はCPU7₀、7₁によってレジスタ300がアクセスされる。CPU7₀のみのデバッグを実行する場合は、信号S31が「H」、信号S32が「L」、信号S30が「L」になるように、レジスタ300が設定される。CPU7₁のみのデバッグを実行する場合は、信号S31が「L」、信号S32が「H」、信号S30が「H」になるように、レジスタ300が設定される。CPU7₀、7₁の双方のデバッグを実行する場合は、信号S31、S32がともに「H」になるように、レジスタ300が設定される。また、この場合は、信号S30が順次に「L」「H」となるように、レジスタ300が設定される。

【0040】

信号S31は、AND回路301の他方の入力端子に入力される。信号S32は、AND回路302の他方の入力端子に入力される。信号S30は、セクタ300の選択端子に入力される。

【0041】

次に、デバッグ装置から端子2～6を介して、TAPコントローラ9のTCK端子、TRST端子、TMS端子、TDI端子に、TCK信号、TRST信号、TMS信号、TDI信号がそれぞれ入力される。そして、TAPコントローラ9は、所定のコマンドを生成して出力する。

【0042】

上記の通り、CPU7₀のみのデバッグを実行する場合、信号S31は「H」、信号S32は「L」である。従って、TAPコントローラ9から出力されたコ

マンドは、AND回路301の出力端子から出力されて、デバッグ実行部8₀に
入力される。一方、デバッグ実行部8₁にはコマンドは入力されない。

【0043】

デバッグ実行部8₀は、CPU7₀にブレーク要求、スタート要求、命令コード
を入力し、CPU7₀のデバッグが実行される。デバッグの結果に関するデータ
は、CPU7₀からデバッグ実行部8₀に入力される。上記の通り、CPU7₀の
みのデバッグを実行する場合、信号S30は「L」である。従って、データは、
デバッグ実行部8₀から、セクタ303、TAPコントローラ9、及び端子6
を介して、外部に出力される。

【0044】

また、上記の通り、CPU7₁のみのデバッグを実行する場合、信号S31は
「L」、信号S32は「H」である。従って、TAPコントローラ9から出力さ
れたコマンドは、AND回路302の出力端子から出力されて、デバッグ実行部
8₁に入力される。一方、デバッグ実行部8₀にはコマンドは入力されない。

【0045】

デバッグ実行部8₁は、CPU7₁にブレーク要求、スタート要求、命令コード
を入力し、CPU7₁のデバッグが実行される。デバッグの結果に関するデータ
は、CPU7₁からデバッグ実行部8₁に入力される。上記の通り、CPU7₁の
みのデバッグを実行する場合、信号S30は「H」である。従って、データは、
デバッグ実行部8₁から、セクタ303、TAPコントローラ9、及び端子6
を介して、外部に出力される。

【0046】

さらに、上記の通り、CPU7₀、7₁の双方のデバッグを実行する場合、信号
S31、S32はともに「H」である。従って、TAPコントローラ9から出力
されたコマンドは、AND回路301、302の各出力端子から出力されて、デ
バッグ実行部8₀、8₁にそれぞれ入力される。その結果、上記と同様にしてCP
U7₀、7₁のデバッグが実行される。また、上記の通り、CPU7₀、7₁の双方
のデバッグを実行する場合、信号S30は順次に「L」「H」となる。従って、
端子6からは、CPU7₀のデバッグの結果に関するデータ、及びCPU7₁のデ

バグの結果に関するデータが、この順に出力される。

【 0 0 4 7 】

なお、以上の説明では、選択回路 3 0 は、デバックを実行すべき CPU 7₀, 7₁ を、レジスタ 3 0 0 の設定に基づいて選択したが、上記実施の形態 2 のように、外部から所定の端子 2 1 ~ 2 3 に入力される選択信号に基づいて選択するよう構成してもよい。

【 0 0 4 8 】

このように本実施の形態 3 に係るマルチプロセッサシステムによれば、選択回路 3 0 は、デバック実行部 8₀, 8₁ と TAP コントローラ 9 との間に接続されている。従って、各 CPU 7₀, 7₁ に対応して TAP コントローラ 9₀, 9₁ を個別に設ける必要がないため、上記実施の形態 1, 2 と比較して、システム構成の簡略化を図ることができる。

【 0 0 4 9 】

実施の形態 4 .

図 4 は、本発明の実施の形態 4 に係るマルチプロセッサシステムの構成を示すブロック図である。チップ 1 は、複数の CPU 7₀, 7₁ と、デバック実行部 8 と、デバック実行部 8 を制御する TAP コントローラ 9 と、CPU 7₀, 7₁ の中から、デバックを実行すべき少なくとも一つの CPU を選択する選択回路 4 0 と、端子 2 ~ 6 を含む一組の端子群とを備えている。TAP コントローラ 9 は端子 2 ~ 6 に接続されており、デバック実行部 8 は TAP コントローラ 9 に接続されている。選択回路 4 0 は、CPU 7₀, 7₁ とデバック実行部 8 との間に接続されている。

【 0 0 5 0 】

選択回路 4 0 は、レジスタ 4 0 0、AND 回路 4 0 2, 4 0 3、及びセクタ 4 0 1 を備えている。AND 回路 4 0 2 の一方の入力端子はデバック実行部 8 に、他方の入力端子はレジスタ 4 0 0 に、出力端子は CPU 7₀ に、それぞれ接続されている。AND 回路 4 0 3 の一方の入力端子はデバック実行部 8 に、他方の入力端子はレジスタ 4 0 0 に、出力端子は CPU 7₁ に、それぞれ接続されている。セクタ 4 0 1 の一方の入力端子は CPU 7₀ に、他方の入力端子は CPU

7₁に、出力端子はデバッグ実行部8に、それぞれ接続されている。

【0051】

次に、本実施の形態4に係るマルチプロセッサシステムの動作について説明する。まず、デバッグを実行すべきCPUを選択するために、デバッグ装置又はCPU7₀、7₁によってレジスタ400がアクセスされる。CPU7₀のみのデバッグを実行する場合は、信号S41が「H」、信号S42が「L」、信号S40が「L」になるように、レジスタ400が設定される。CPU7₁のみのデバッグを実行する場合は、信号S41が「L」、信号S42が「H」、信号S40が「H」になるように、レジスタ400が設定される。CPU7₀、7₁の双方のデバッグを実行する場合は、信号S41、S42がともに「H」になるように、レジスタ400が設定される。また、この場合は、信号S40が順次に「L」「H」となるように、レジスタ400が設定される。

【0052】

信号S41は、AND回路402の他方の入力端子に入力される。信号S42は、AND回路403の他方の入力端子に入力される。信号S40は、セレクタ400の選択端子に入力される。

【0053】

次に、デバッグ装置から端子2～6を介して、TAPコントローラ9のTCK端子、TRST端子、TMS端子、TDI端子に、TCK信号、TRST信号、TMS信号、TDI信号がそれぞれ入力される。そして、TAPコントローラ9は、所定のコマンドを生成して出力する。TAPコントローラ9から出力されたコマンドは、デバッグ実行部8に入力される。デバッグ実行部8は、ブレーク要求、スタート要求、命令コードを生成して出力する。

【0054】

上記の通り、CPU7₀のみのデバッグを実行する場合、信号S41は「H」、信号S42は「L」である。従って、デバッグ実行部8から出力された命令コード等は、AND回路402の出力端子から出力されて、CPU7₀に入力される。これにより、CPU7₀のデバッグが実行される。一方、CPU7₁には命令コード等は入力されない。また、上記の通り、CPU7₀のみのデバッグを実行

する場合、信号 S 4 0 は「L」である。従って、CPU 7₀のデバッグの結果に関するデータは、CPU 7₀から、セクタ 4 0 1、デバッグ実行部 8、TAP コントローラ 9、及び端子 6 を介して、外部に出力される。

【 0 0 5 5 】

また、上記の通り、CPU 7₁のみのデバッグを実行する場合、信号 S 4 1 は「L」、信号 S 4 2 は「H」である。従って、デバッグ実行部 8 から出力された命令コード等は、AND 回路 4 0 3 の出力端子から出力されて、CPU 7₁に力される。これにより、CPU 7₁のデバッグが実行される。一方、CPU 7₀には命令コード等は入力されない。また、上記の通り、CPU 7₁のみのデバッグを実行する場合、信号 S 4 0 は「H」である。従って、CPU 7₁のデバッグの結果に関するデータは、CPU 7₁から、セクタ 4 0 1、デバッグ実行部 8、TAP コントローラ 9、及び端子 6 を介して、外部に出力される。

【 0 0 5 6 】

さらに、上記の通り、CPU 7₀、7₁の双方のデバッグを実行する場合、信号 S 4 1、S 4 2 はともに「H」である。従って、デバッグ実行部 8 から出力された命令コード等は、AND 回路 4 0 2、4 0 3 の各出力端子から出力されて、CPU 7₀、7₁にそれぞれ入力される。その結果、上記と同様にして CPU 7₀、7₁のデバッグが実行される。また、上記の通り、CPU 7₀、7₁の双方のデバッグを実行する場合、信号 S 4 0 は順次に「L」「H」となる。従って、端子 6 からは、CPU 7₀のデバッグの結果に関するデータ、及び CPU 7₁のデバッグの結果に関するデータが、この順に出力される。

【 0 0 5 7 】

なお、以上の説明では、選択回路 4 0 は、デバックを実行すべき CPU 7₀、7₁を、レジスタ 4 0 0 の設定に基づいて選択したが、上記実施の形態 2 のように、外部から所定の端子 2 1 ~ 2 3 に入力される選択信号に基づいて選択するよう構成してもよい。

【 0 0 5 8 】

このように本実施の形態 4 に係るマルチプロセッサシステムによれば、選択回路 4 0 は、CPU 7₀、7₁とデバック実行部 8 との間に接続されている。従って

、各CPU7₀、7₁に対応してデバッグ実行部8₀、8₁及びTAPコントローラ9₀、9₁をそれぞれ個別に設ける必要がないため、上記実施の形態1、2と比較して、システム構成の簡略化を図ることができる。

【0059】

実施の形態5.

図5は、本発明の実施の形態5に係るマルチプロセッサシステムの構成を示すブロック図である。チップ1は、複数のCPU7₀、7₁と、CPU7₀、7₁のデバッグを実行するデバッグ実行部8₀、8₁と、デバッグ実行部8₀、8₁を制御するTAPコントローラ9₀、9₁と、端子2₀～6₀を含む第1の端子群と、端子2₁～6₁を含む第2の端子群とを備えている。

【0060】

本実施の形態5に係るマルチプロセッサシステムは、第1及び第2の端子群の双方に第1及び第2のデバッグ装置がそれぞれ接続される第1モードと、第1の端子群のみに第1のデバッグ装置が接続される第2モードとを切り替えて、使用することが可能である。第1モードと第2モードとの切り替えは、端子56及びスイッチ51₀～54₀、51₁～54₁、55によって実現されている。

【0061】

また、本実施の形態5に係るマルチプロセッサシステムは、第2モードにおいて、第1のデバッグ装置から第1の端子群を介して入力されてきたデバッグ用の信号を、TAPコントローラ9₀、9₁のうちの一方又は双方に選択的に入力するための、選択回路50をさらに備えている。選択回路50は、上記実施の形態1、2に係る選択回路10、20と同様にして構成することができる。

【0062】

CPU7₀、7₁は、それぞれデバッグ実行部8₀、8₁に接続されており、デバッグ実行部8₀、8₁は、それぞれTAPコントローラ9₀、9₁に接続されている。TAPコントローラ9₀のTCK端子、TRST端子、TMS端子、TDI端子は、スイッチ51₀～54₀を介して、端子2₀～5₀及び選択回路50のTCK0端子、TRST0端子、TMS0端子、TDI0端子にそれぞれ接続されている。また、TAPコントローラ9₀のTDO端子は、選択回路50のTDO0端

子に接続されるとともに、スイッチ 5 5 を介して端子 6₀ に接続されている。同様に、TAP コントローラ 9₁ の TCK 端子、TRST 端子、TMS 端子、TDI 端子は、スイッチ 5 1₁ ~ 5 4₁ を介して、端子 2₁ ~ 5₁ 及び選択回路 5 0 の TCK 1 端子、TRST 1 端子、TMS 1 端子、TDI 1 端子にそれぞれ接続されている。また、TAP コントローラ 9₁ の TDO 端子は、選択回路 5 0 の TDO 1 端子及び端子 6₁ に接続されている。

【 0 0 6 3 】

選択回路 5 0 の TDOP 端子は、スイッチ 5 5 を介して端子 6₀ に接続されている。また、選択回路 5 0 の TCKP 端子、TRSTP 端子、TMS P 端子、TDIP 端子は、それぞれ端子 2₀ ~ 5₀ に接続されている。

【 0 0 6 4 】

スイッチ 5 1₀ ~ 5 4₀, 5 1₁ ~ 5 4₁, 5 5 の切り替え（即ち第 1 モードと第 2 モードとの切り替え）は、外部から端子 5 6 に入力される信号 S 5 6 に基づいて行われる。

【 0 0 6 5 】

次に、本実施の形態 5 に係るマルチプロセッサシステムの動作について説明する。まず、第 1 モードの動作について説明する。第 1 モードにおいて、スイッチ 5 1₀ ~ 5 4₀ はそれぞれ端子 2₀ ~ 5₀ 側に切り替えられ、スイッチ 5 1₁ ~ 5 4₁ はそれぞれ端子 2₁ ~ 5₁ 側に切り替えられ、スイッチ 5 5 は TAP コントローラ 9₀ の TDO 端子側に切り替えられる。これにより、TAP コントローラ 9₀ は端子 2₀ ~ 6₀ に直接的に接続されるとともに、TAP コントローラ 9₁ は端子 2₁ ~ 6₁ に直接的に接続される。そして、端子 2₀ ~ 6₀ に接続された第 1 のデバッグ装置を用いて CPU 7₀ のデバッグが実行されるとともに、端子 2₁ ~ 6₁ に接続された第 2 のデバッグ装置を用いて CPU 7₁ のデバッグが実行される。

【 0 0 6 6 】

次に、第 2 モードの動作について説明する。図 5 に示すように、第 2 モードにおいて、スイッチ 5 1₀ ~ 5 4₀, 5 1₁ ~ 5 4₁, 5 5 は、それぞれ選択回路 5 0 側に切り替えられる。これにより、TAP コントローラ 9₀, 9₁ は、選択回路 5 0 を介して端子 2₀ ~ 6₀ に接続される。そして、上記実施の形態 1, 2 と同様に

、デバッグを実行すべき少なくとも一つのCPU7₀, 7₁が、選択回路50によって選択される。その後、端子2₀~6₀に接続された第1のデバッグ装置を用いて、デバッグが実行される。

【0067】

このように本実施の形態5に係るマルチプロセッサシステムによれば、チップ1に搭載されているCPU7₀, 7₁の個数と同数のデバッグ装置を用意できる場合には、第1モードに切り替えることにより、複数のデバッグ装置を用いて各CPU7₀, 7₁のデバッグを独立に実行することができる。一方、1台のデバッグ装置しか用意できない場合には、第2モードに切り替えることにより、選択回路50の選択によってCPU7₀, 7₁のデバッグを実行することができる。

【0068】

また、端子56を用いた簡単な構成によって第1モードと第2モードとの切り替えが実現されているため、システムが大型化・複雑化することを、最小限にとどめることができる。

【0069】

実施の形態6.

図6は、本発明の実施の形態6に係るマルチプロセッサシステムの構成を示すブロック図である。上記実施の形態5では、第1モードと第2モードとの切り替えは、外部から端子56に入力される信号S56に基づいて行われた。これに対し、本実施の形態6において、第1モードと第2モードとの切り替えは、チップ1に配設された所定のレジスタ60の設定に基づいて行われる。

【0070】

図6を参照して、スイッチ51₀~54₀, 51₁~54₁, 55の切り替えは、レジスタ60から出力される信号S60に基づいて行われる。具体的には、上記実施の形態5と同様に、第1モードにおいて、スイッチ51₀~54₀はそれぞれ端子2₀~5₀側に切り替えられ、スイッチ51₁~54₁はそれぞれ端子2₁~5₁側に切り替えられ、スイッチ55はTAPコントローラ9₀のTDO端子側に切り替えられる。一方、第2モードにおいて、スイッチ51₀~54₀, 51₁~54₁, 55は、それぞれ選択回路50側に切り替えられる。その他の構成・動作

は上記実施の形態 5 と同様であるため、説明は省略する。

【 0 0 7 1 】

このように本実施の形態 6 に係るマルチプロセッサシステムによれば、レジスタ 6 0 を用いた簡単な構成によって第 1 モードと第 2 モードとの切り替えが実現されているため、システムが大型化・複雑化することを、最小限にとどめることができる。

【 0 0 7 2 】

実施の形態 7.

図 7 は、本発明の実施の形態 7 に係るマルチプロセッサシステムの構成を示すブロック図である。上記実施の形態 5 では、第 1 モードと第 2 モードとの切り替えは、外部から端子 5 6 に入力される信号 S 5 6 に基づいて行われた。これに対し、本実施の形態 7 に係るマルチプロセッサシステムは、第 2 の端子群に第 2 のデバッグ装置が接続されているか否かを検出するクロック検出回路 7 0 をさらに備え、第 1 モードと第 2 モードとの切り替えは、クロック検出回路 7 0 の検出結果である信号 S 7 0 に基づいて行われる。

【 0 0 7 3 】

図 7 を参照して、クロック検出回路 7 0 は、端子 2₁ に接続されている。第 2 の端子群に第 2 のデバッグ装置が接続されていれば、第 2 のデバッグ装置から端子 2₁ を介してクロック検出回路 7 0 にクロックが入力される。クロック検出回路 7 0 は、クロックが入力されていることを検出すると、スイッチ 5 1₀ ~ 5 4₀ をそれぞれ端子 2₀ ~ 5₀ 側に切り替え、スイッチ 5 1₁ ~ 5 4₁ をそれぞれ端子 2₁ ~ 5₁ 側に切り替え、スイッチ 5 5 を T A P コントローラ 9₀ の T D O 端子側に切り替える。一方、第 2 の端子群に第 2 のデバッグ装置が接続されていなければ、クロック検出回路 7 0 にはクロックが入力されない。クロック検出回路 7 0 は、クロックが入力されていないことを検出すると、スイッチ 5 1₀ ~ 5 4₀, 5 1₁ ~ 5 4₁, 5 5 を、それぞれ選択回路 5 0 側に切り替える。その他の構成・動作は上記実施の形態 5 と同様であるため、説明は省略する。

【 0 0 7 4 】

このように本実施の形態 7 に係るマルチプロセッサシステムによれば、クロッ

ク検出回路 70 を用いた簡単な構成によって第 1 モードと第 2 モードとの切り替えが実現されているため、システムが大型化・複雑化することを、最小限にとどめることができる。

【 0 0 7 5 】

【発明の効果】

第 1 の発明に係るマルチプロセッサシステムによれば、一台のデバッグ装置のみを用いて所望のプロセッサのデバッグを実行できるため、コストの低減を図ることができる。

【 0 0 7 6 】

第 2 の発明に係るマルチプロセッサシステムによれば、用意できるデバッグ装置の台数に応じて第 1 モードと第 2 モードとを切り替えることにより、第 1 及び第 2 のプロセッサのデバッグを適切に実行することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の実施の形態 1 に係るマルチプロセッサシステムの構成を示すブロック図である。

【図 2】 本発明の実施の形態 2 に係るマルチプロセッサシステムの構成を示すブロック図である。

【図 3】 本発明の実施の形態 3 に係るマルチプロセッサシステムの構成を示すブロック図である。

【図 4】 本発明の実施の形態 4 に係るマルチプロセッサシステムの構成を示すブロック図である。

【図 5】 本発明の実施の形態 5 に係るマルチプロセッサシステムの構成を示すブロック図である。

【図 6】 本発明の実施の形態 6 に係るマルチプロセッサシステムの構成を示すブロック図である。

【図 7】 本発明の実施の形態 7 に係るマルチプロセッサシステムの構成を示すブロック図である。

【符号の説明】

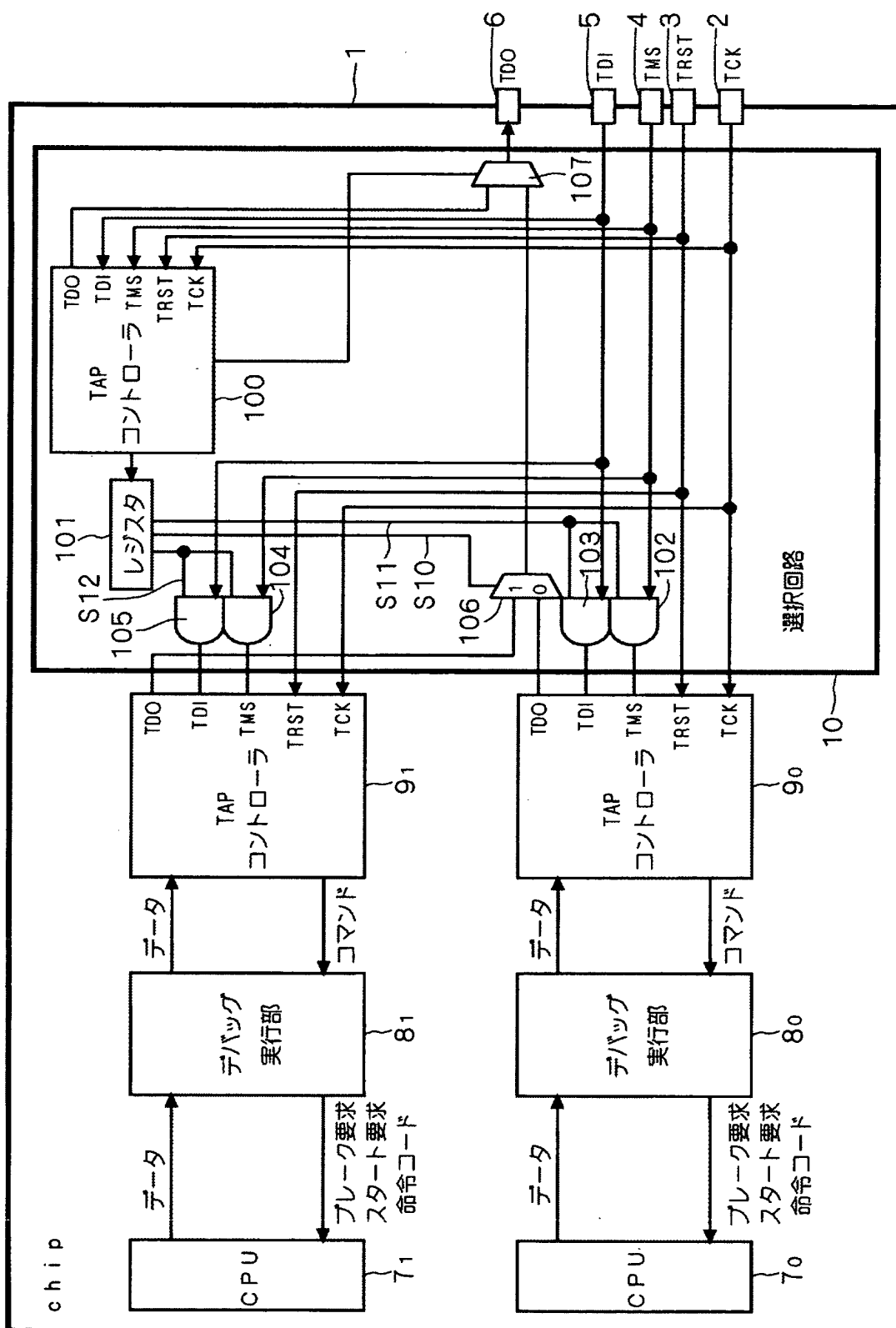
1 チップ、2～6, 2₀～6₀, 2₁～6₁, 2₁～2₃ 端子、7₀, 7₁ C

PU、8、8₀、8₁ デバッグ実行部、9、9₀、9₁ TAPコントローラ、1
0、20、30、40、50 選択回路、60、101、300、400 レジ
スタ、70 クロック検出回路。

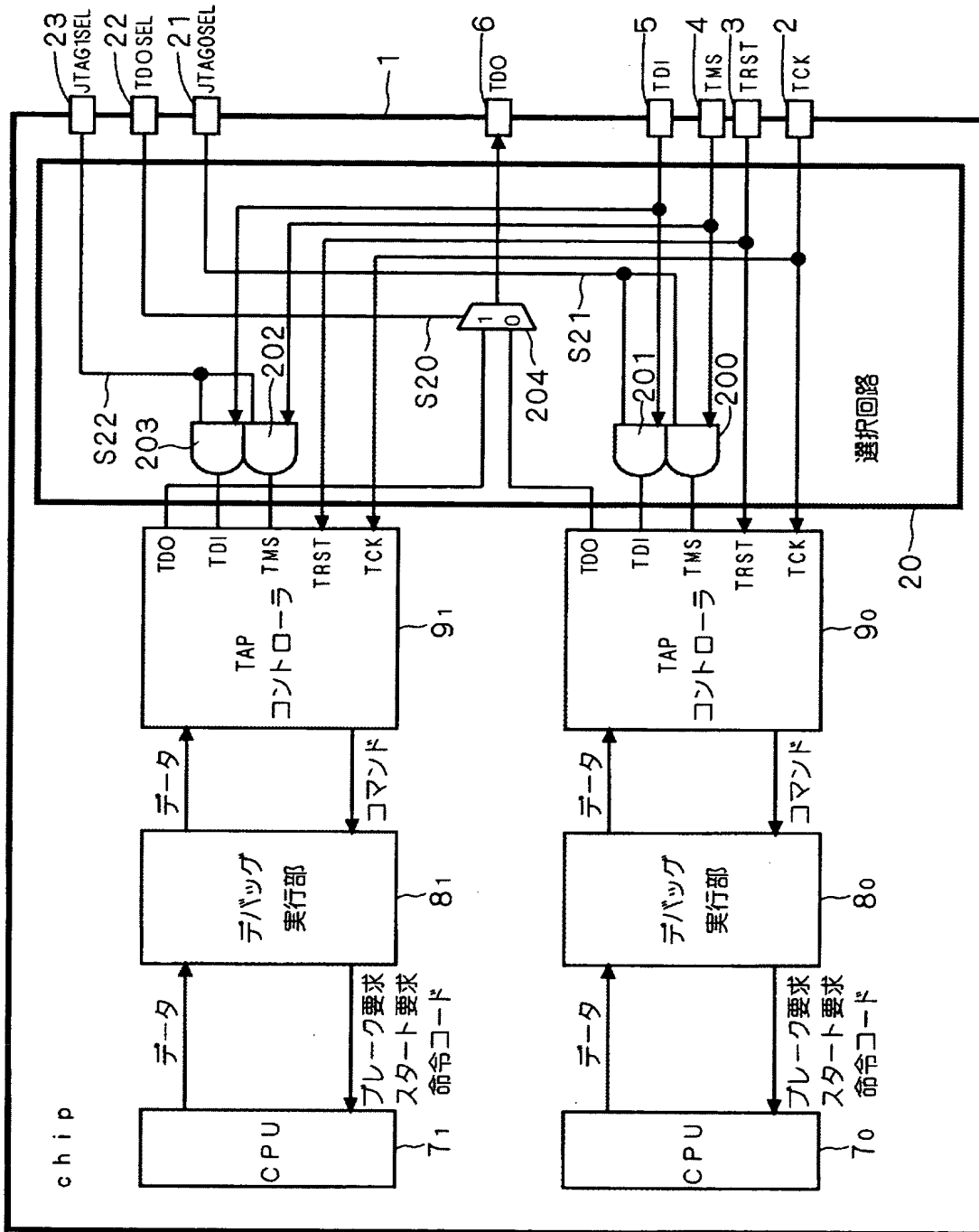
【書類名】

図面

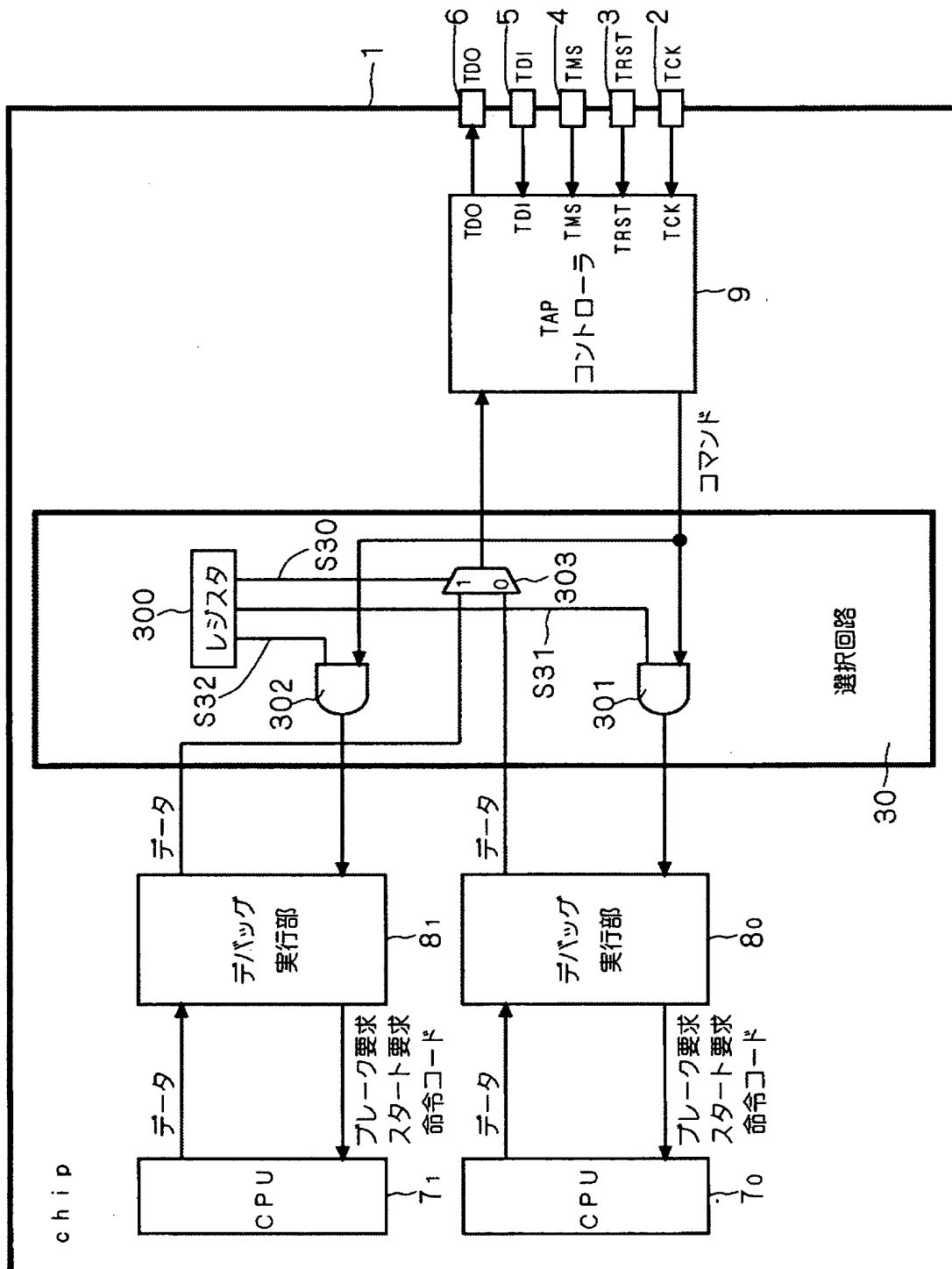
【図 1】



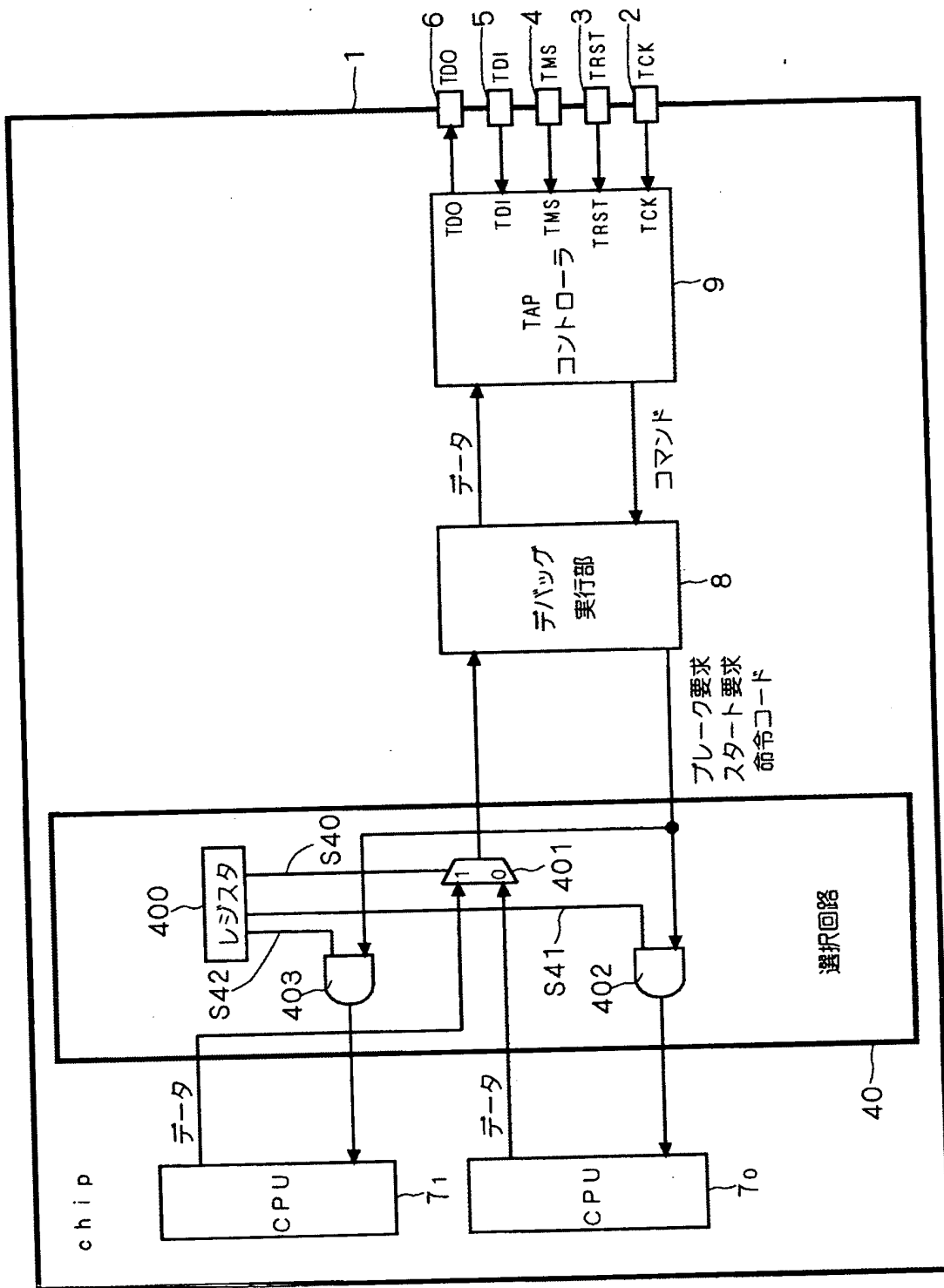
【図2】



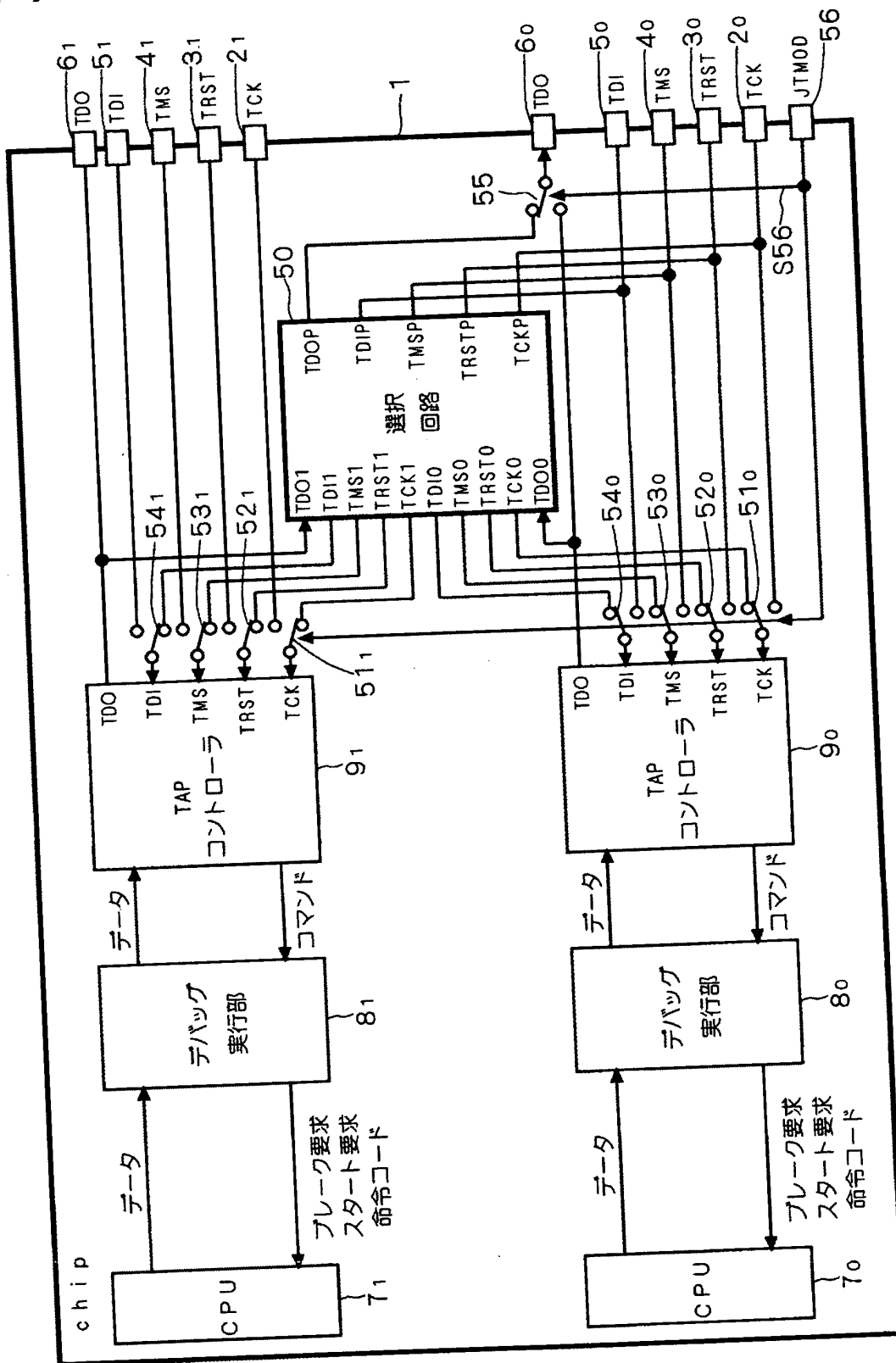
【図 3】



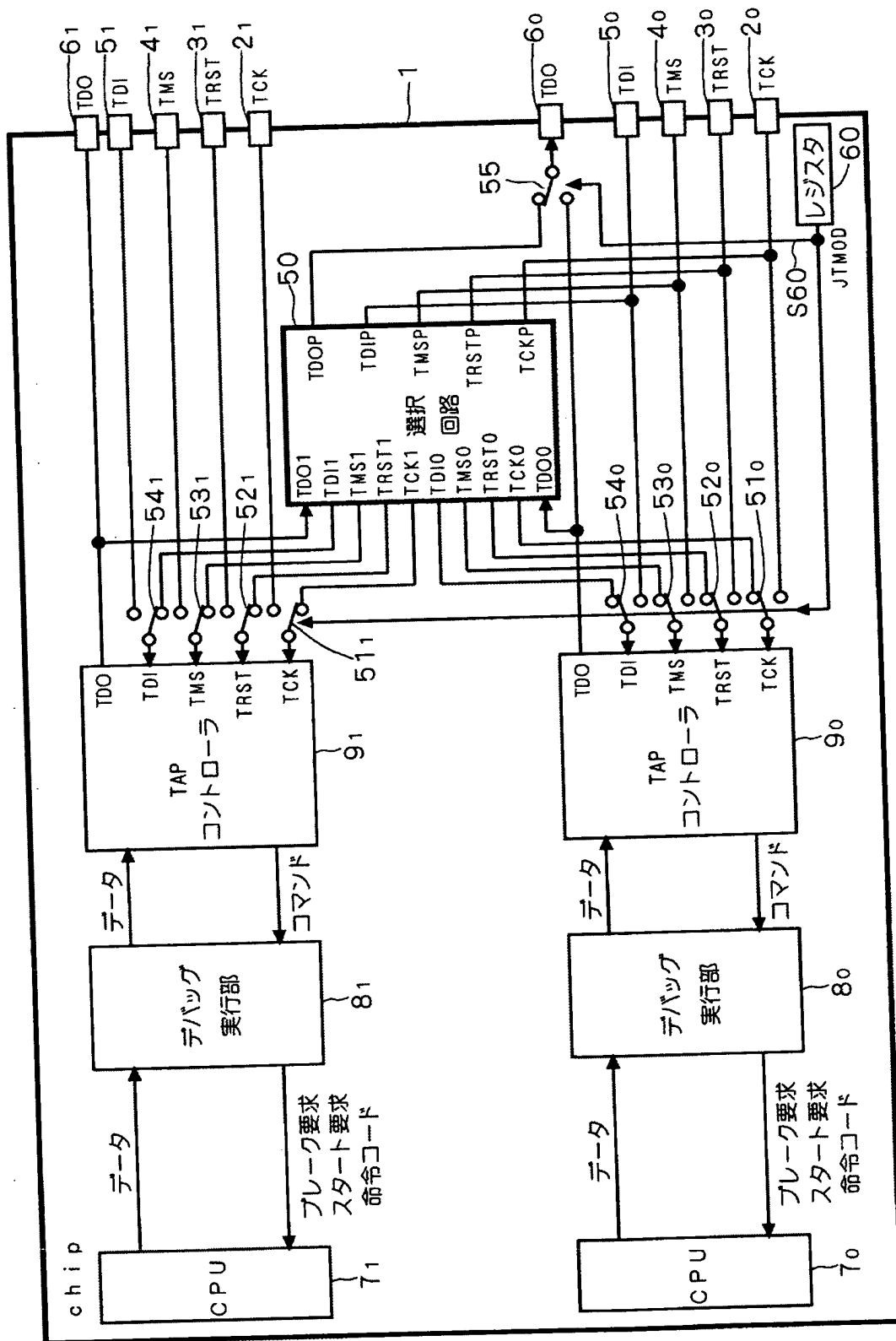
【図 4】



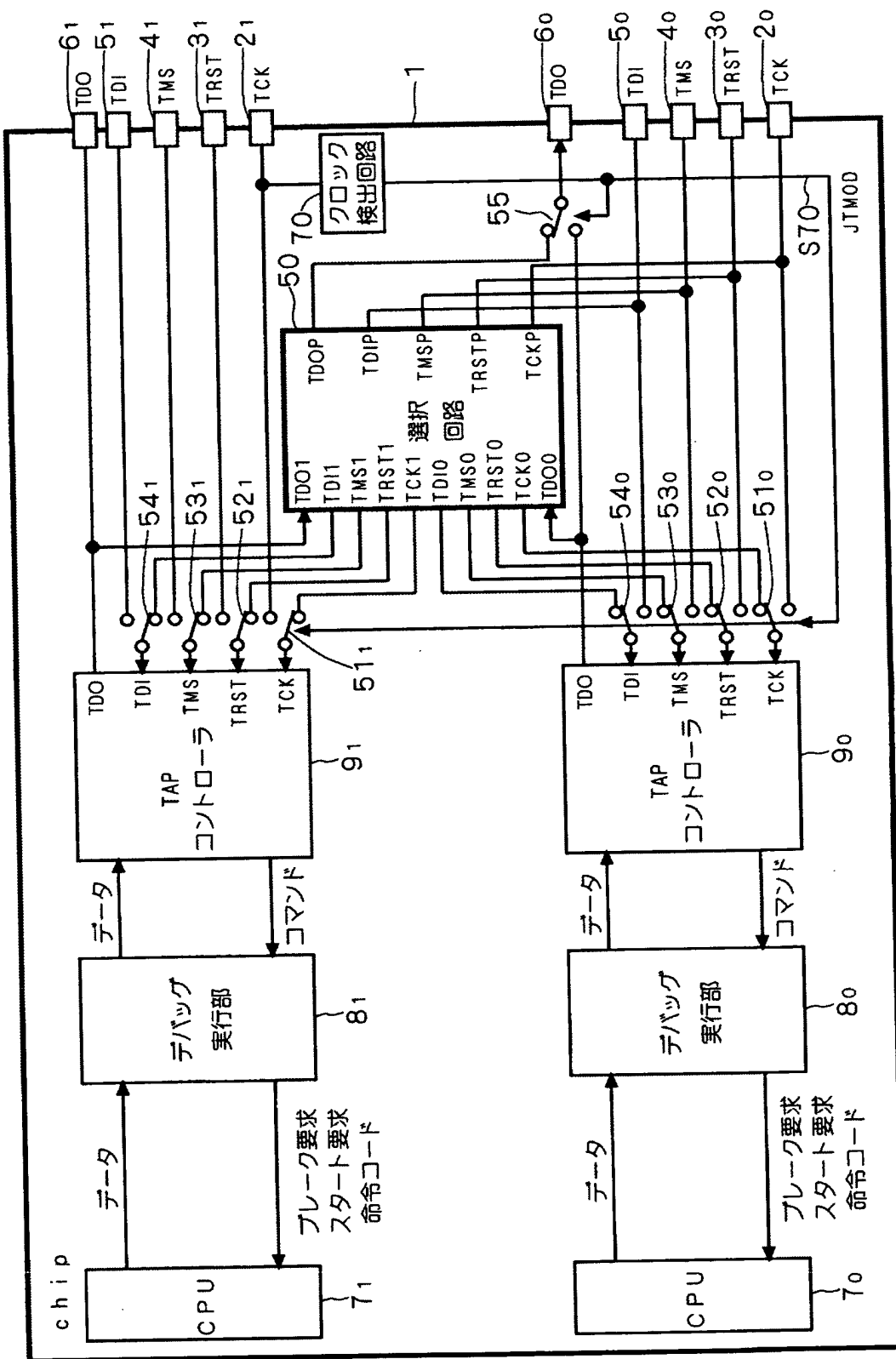
【図 5】



【図6】



【図 7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 コストの低減を図りつつ、複数のプロセッサのデバッグを効率的に実行することが可能なマルチプロセッサシステムを得る。

【解決手段】 チップ1は、CPU7₀、7₁と、デバッグ実行部8₀、8₁と、TAPコントローラ9₀、9₁と、選択回路10と、端子2～6を含む一組の端子群とを備えている。CPU7₀のみのデバッグを実行する場合、TAPコントローラ100は、信号S11が「H」、信号S12が「L」になるように、レジスタ101を設定する。CPU7₁のみのデバッグを実行する場合、TAPコントローラ100は、信号S11が「L」、信号S12が「H」になるように、レジスタ101を設定する。CPU7₀、7₁の双方のデバッグを実行する場合、TAPコントローラ100は、信号S11、S12がともに「H」になるように、レジスタ101を設定する。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 6 0 1 3]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 8 月 2 4 日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都千代田区丸の内 2 丁目 2 番 3 号
氏 名	三菱電機株式会社